

製造プロセス改革セミナー：走査型電子顕微鏡による評価・解析

日 時：8月24日（木） 14:00～17:00

会 場：品川産業支援交流施設(SHIP)第1会議室 / 北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F

申 込：下記申込先まで、氏名・会社名・連絡先・試料の持ち込みの有無をご記入の上、
メールにて送信ください。

申込締め切り：8月22日（火）

定 員：10名（先着）

講 師：株式会社日立ハイテクフィールドディング 西村 雅子 氏

走査型電子顕微鏡の基本が学べるセミナーを開催いたします!!

内 容

講演（14:00～16:00）

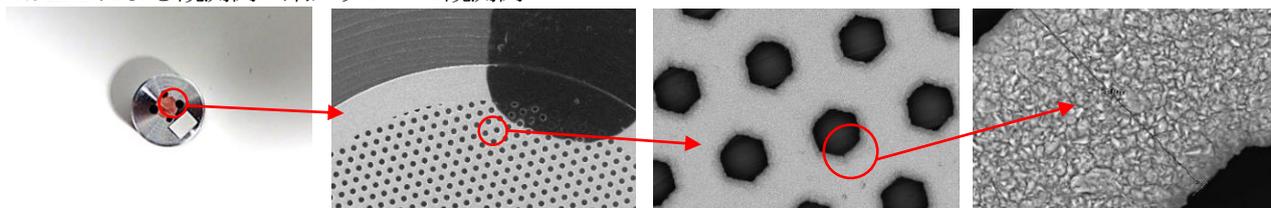
① 走査電子顕微鏡(SEM)の原理と観察テクニック ～SEMで何ができるのか～

② 走査電子顕微鏡(SEM)試料前処理の基礎 ～SEM観察のために何かが必要か～

TM3030Plusでの試料観察（16:00～17:00）

★ 希望者の方は、観察したい試料をお持ちいただき、観察していただくことができます。

SEMによる観測例：銅メッシュの観測例



★ 走査型電子顕微鏡(SEM)とは



走査型電子顕微鏡 (SEM)は、電子ビームによって対象物を観察する機器です。光学顕微鏡と比較すると焦点深度が深いので、広範囲に焦点の合った立体的な像を得ることができます。SEMを用いることによって電子回路、半導体部品や生体試料など、試料の表面構造を微細に観察が可能になります。

お問い合わせ・申込先 【品川ビジネスクラブ事務局】担当：鈴木

住所：品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4階 / Web：<http://shinagawa-businessclub.jp>

TEL：03-5449-6557 / Email：suzuki@shinagawa-businessclub.jp